



第31回プラントショー出展のお知らせ

名称：第31回プラントショー [INCHEM TOKYO 2017 内]
 会期：2017年11月20日(月)～22日(水) 10:00～18:00 (最終日は17:00まで)
 会場：東京ビッグサイト (東京都江東区有明3-11-1)
 出展場所：東1ホール No. 1F-08
 URL：<http://www.ipfjapan.jp/index.php>

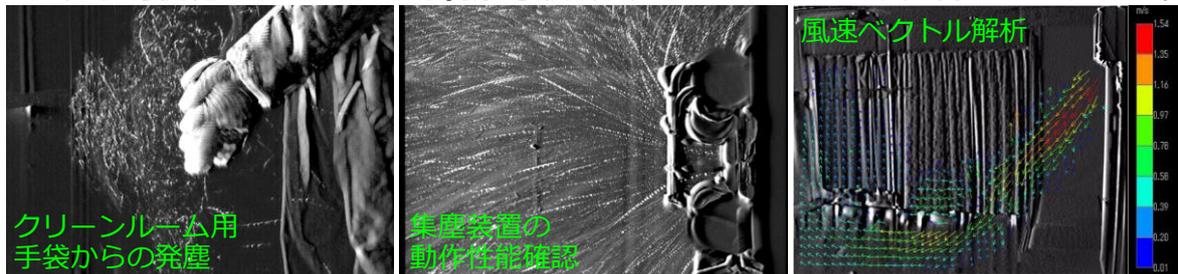


※上記 URL より来場事前登録[登録無料]をすることができます

世界最高水準の「微粒子可視化システム」を出展します



微粒子可視化システムによる撮影事例 (当社ホームページに動画が掲載されています)



ヒット商品の「Dライト」はマイナーチェンジし、より使いやすくなりました！



表面異物識別ツール **Dライト**

観察例：キーボードの汚れ

自社ブランド「ViEST®」として展開している当社の微粒子可視化技術は、80ナノメートルの浮遊粒子をリアルタイムに映像化できる世界最高水準の撮影感度をもった可視化技術です。国内外で、各種装置やシステムの販売、システムを利用した受託サービス(生産工程や製造装置内外における微粒子や気流の挙動調査、各種設備性能の評価など)を展開しています。

本展では、可視化システムや撮影事例動画を展示し、微粒子可視化のデモンストレーションも実施いたします。また、さまざまな業界から高い評価をいただいている「Dライト」や「plus Tracer」のほか、今年度販売を開始した新商品をすべて展示します。当社の高感度な可視化技術を是非会場でご体感ください。

＜本件に関する問い合わせ先＞

ビジュアルソリューション事業部 Tel: 03-3639-2206 E-mail: viest@snk.co.jp

～ 詳しくはホームページをご覧ください <http://www.snk.co.jp/particle> ～